

**KBSI** 한국기초과학지원연구원

출원인 | 한국기초과학지원연구원

특허등록번호

| 10-1555153

발명자 | 장기수 외 1

Ref.

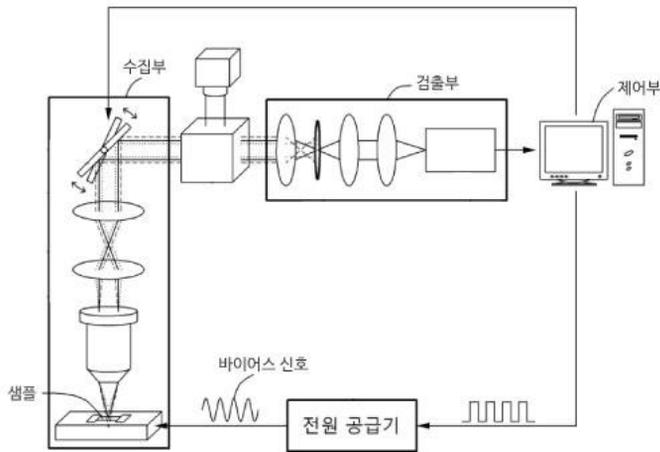
| smk\_KBSI2016005

## 활용 분야

- 반도체
- 반도체 소자의 발열 특성 분석

## 기술개요

- 1) 특징 - 샘플에 인가된 바이어스 신호를 기초로 반사율이 변화하는 반사 신호를 수집하고, 반사 신호에서 샘플의 관심 영역으로부터 반사된 관심 신호를 검출하며, 관심 신호를 주파수 영역 신호로 변환하고, 주파수 영역 신호에 대한 필터링을 기초로 추출된 직류 성분 및 바이어스 신호의 주파수 성분을 이용하여 샘플의 상대적인 반사율 변화량을 연산하고, 상대적인 반사율 변화량에 기초하여 샘플의 발열 이미지를 획득



- 2) 효과 - 주기적인 반사율 변화를 용이하게 측정, 반사율 변화 측정 민감도를 향상

## 상담신청



신청자

ntlo.kr

'M스페이스-기술상담' 클릭



신청자

관련 글 작성



공동 TLO

연락 및  
상담내용 확인



연구자, 공동TLO, 상담기업  
미팅 진행

## 담당자 연락처